

MODEL 8800

ハイエンド基板向け高精度検査装置

High precision Flying Prober for High-end PCB



- ☑ 高速・高剛性の縦型4本プローブ方式
Ultra fast and rigidity Vertical 4-Probe tester.
- ☑ 高精度なプロービング能力
Precise probing capabilities.
- ☑ 高精度4端子ケルビン検査機能
4-Wire Kelvin low resistance test.
- ☑ 埋め込み受動素子検査機能
Embedded passive components test.
- ☑ Flex 基板対応フレーム
Robust frame for FLEX PCB.

仕様 (Specification)

適用 (Application)	
外形 / 重量 (Dimensions / Weight)	1,560 (w) x 850 (d) x 1,900 (h) mm / 1,250 kg
電源 (Power requirements)	AC 200 - 230 V $\pm$ 10% 3 ϕ / 30 A 注3 (Note 3)
エアー (Air requirements)	0.5MPa 100ℓ/min 以上 注3 (Note 3)
最大検査エリア (Maximum test area)	610 × 510 mm
基板サイズ (Board size)	50 × 50 mm - 620 × 520 mm
板厚 (Thickness)	0.1 ~ 6 mm

システム仕様 (System specification)		Standard	Option
最小測定サイズ (Minimum test size)	パターンピッチ (Pattern pitch)	40 μ m	40 μ m 注1 (Note 1)
	パッドサイズ (Pad size)	20 μ m	15 μ m 注1, 2 (Notes 1, 2)
プローブ (Probe)	数 (Probe heads)	4 本 (表: 2本 / 裏: 2本) 4 probes (2 probes on each side)	
	繰り返し精度 (Repeatability accuracy)	$\pm$ 1 μ m	
	接触圧 (Contact pressure)	2 - 10 g (min)	
CCD カメラ (CCD camera)		4 台 (表: 1台 / 裏: 1台) 4 Units (1 unit / side)	
絶縁検査電圧 (Isolation Test voltage)		1000V (最大) 1000 V (max)	注4 (Note 4)
低抵抗検査電流 (Low resistance Test current)		100mA	公称 (Typ)

検査方式 (Test technique)	オープン検出測定 (導通検査) 注5 (Note 5) Open detection (Continuity Test)	設定範囲: 1 Ω - 1G Ω (Range : 1 Ω - 1G Ω)	
	ショート検出測定 (絶縁測定) Short detection (Isolation Test)	設定範囲: 500 M Ω (最大)迄 (Range : up to 500 M Ω max)	設定範囲: 1.0 G Ω (最大)迄 (Range : up to 1.0 G Ω max)
	容量測定 Capacitance measurement	マスター値による相対比較 (Comparison with master data)	
	低抵抗測定 4 wire Low resistance measurement	設定範囲 1.0m Ω - 10k Ω (Range: 1.0m Ω - 10k Ω)	
	埋込み素子テスト機能 Embedded passive component test function	Resistance Capacitance	Range: 1 m Ω to 1G Ω (Typ) including 4WK range Range: 1pF to 10uF (Typ)
	Option Inductance	Inductance	Range: 10uH to 100mH (Typ)
検査データ編集 (Data Management) 注6 (Note 6)	入力フォーマット (Input format)	IPC D 356A / MNF / Others	
	Job編集支援ソフト (Job Creator)	Job Creator	Optionally available CAM Software
	検査データ作成ソフト (Test data preparation)	Smart Test	Optionally available Software
	不良解析ソフト (Failure analysis)	市販解析ソフトウェア	(Commercially available S/W)

注意事項 (Notes):

- 室温23 $\pm$ 3 $^{\circ}$ Cにて規定。Specified at room temperature = 23 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C.
- プローブ先端径を考慮せず、装置のプロービング動作として規定。As the probing performance of machine, not as the specification including probe tip.
- 電源トランスや低電圧装置等が必要となる場合は、別途お問い合わせください。If an additional transformer, Automatic Voltage Regulator (AVR), etc. are required, please consult with us or our agent in the region.
- 被測定物に応じて正しい印加電圧レベルの設定が必要です。Depending on the PCB under test, it requires to setup the right input voltage level.
- 低抵抗領域での接触抵抗を含みません。Low Resistance measurement range not included.
- 詳細は別途、お問い合わせください。Consult with us or our agent for the details.

Qualified Agent (in Asia) / 正規代理店

お問い合わせは
Inquiry

アルファデザイン株式会社

本社 Head Office 〒389-0511 長野県東御市滋野甲 2211-3
 2211-3 Ko, Shigeno, Tomi-city, Nagano
 389-0511 Japan
<http://www.alpha-design.co.jp>

宇都宮事業所 Sales Branch 栃木県河内郡上三川町多功2579-8 〒329-0524
 2579-8 Takou, Kaminokawa-machi, Kawachi-gun,
 Tochigi 329-0524 Japan
 T : +81-285-38-7577 / F : +81-285-38-7571

お問い合わせ English
 Inquiry <http://www.alpha-design.co.jp/english/products/catalog.php>
 Japanese
<http://www.alpha-design.co.jp/contact/index.php>